

計測研究会

〔委員長〕 大谷昭仁(日本大学)

〔副委員長〕 仲嶋 一(福山大学)

〔幹事〕 作本義孝(日本大学), 今池 健(日本大学)

〔幹事補佐〕 白井照光(日本電気計器検定所), 小平和明(日本電気計器検定所)

日時 2017年10月27日(金) 14:00~16:40

場所 電気学会会議室(電気学会会議室(電気学会 会議室(電気学会 会議室 東京都千代田区五番町6-2, 交通:JR 総武線(中央線各駅停車)市ヶ谷駅下車 徒歩2分。詳細は次の URL をご参照ください。 http://www.iee.jp/?page_id=369)〔企画担当 作本義孝(日本大学)、河村尚志(アンリツ)〕

協賛 IEEE Instrumentation & Measurement Tokyo/Japan Sections Joint Chapter

議題 テーマ「計測一般」

10月27日(金) 14:00~15:15 テーマ「計測一般」

座長 作本義孝(日本大学)

IM-17-026 対数正規分布の部分的 Q-Q 確率プロットによる分布推定法

○佐山周次(防衛大学校)

IM-17-027 平面近傍界測定によるアンテナの利得測定

○河村尚志(アンリツ)

IM-17-028 白色干渉の振幅情報と位相情報に基づく 極めて薄い透明電極 ITO 膜厚の計測

○陳 凱,雷 楓,伊藤雅英(筑波大学)

10月27日(金) 15:25~16:40 テーマ「計測一般」

座長 河村尚志(アンリツ株式会社)

IM-17-029 ミリ波帯材料特性の不確かさによる LTCC 回路の伝送損失予測と測定

◎She Yuanfeng,加藤悠人,黒川 悟(産業技術総合研究所),廣川二郎(東京工業大学)

IM-17-030 広帯域アンテナを用いた 1 アンテナ法によるグランドプレーン反射面の影響評価

◎松川沙弥果,黒川 悟,She Yuanfeng(産業技術総合研究所)

IM-17-031 各種プローブによる Kim 法で測定された絶対利得誤差

○廣瀬雅信,黒川 悟(産業技術総合研究所)

※ 1 件当り 25 分(質疑応答 5 分を含む)